Research article

Available in: http://jips.ippi.ac.ir

Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), Vol. 36, No. 5, 509-519 December 2023-January 2024 ISSN: 1016-3255 Online ISSN: 2008-0883 DOI: 10.22063/JIPST.2024.3440.2254

Dependence of Dielectric Constant and Mechanical Properties of Expanded Polystyrene Foam on Cell Wall Thickness

Dariush Gudarzi, Seyed Mohammad Hosseini, Mohammad Reza Pourhosseini*, Mahmoud Razavizadeh, Mohammad Khabiri, Milad Saadat Taghroodi

Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, P.O. Box 15875-1774, Tehran, Iran

Received: 31 July 2023, accepted: 6 April 2024

ABSTRACT

Hequipment. Foaming of the polymers is an effective method to reduce their dielectric constants further, as the influence of the microstructural characteristics of the expanded polystyrene foams is important for their dielectric constant further, as the influence of the microstructural characteristics and mechanical properties. This article focuses on the effect of cell wall thickness of the expanded polystyrene foams on their dielectric constant, loss factor, hardness and resilience.

Methods: Many samples of the expanded polystyrene foam with different porosity and overall thickness values were prepared using a specific thermal procedure in a programmable oven. At first, the physical properties such as density and porosity of the expanded polystyrene foams were measured. Next, their microstructural characteristics such as the average cell wall thickness of the expanded polystyrene foams were investigated using a scanning electron microscope. The dielectric constant and loss factor of the samples were assessed with a vector network analyzer with a lens horn antenna. The mechanical properties of the expanded polystyrene foams were evaluated according to Shore D hardness, and the value of mechanical energy stored in them was measured by a resilience tester.

Findings: By increasing cell wall thickness in samples at equal overall thickness, the dielectric characteristics such as dielectric constant and dielectric loss factor increase by 12% and 53%, respectively. Moreover, the mechanical properties such as hardness and resilience reveal an increase of 40 and 42%, respectively, due to the increase of cell wall thickness in samples at the same overall thickness. While the dielectric constant and the dielectric loss factor decrease with the reduction of the overall thickness at the same cell wall thickness, the variation of the overall thickness depicts no effect on the hardness and resilience.

(*)To whom correspondence should be addressed. E-mail: mrp_polycrc@mut.ac.ir

Please cite this article using:

Gudarzi D., Hosseini S.M., Pourhosseini M.R., Razavizadeh M., Khabiri M., Saadat Taghroodi M., Dependence of Dielectric Constant and Mechanical Properties of Expanded Polystyrene on Cell Wall Thickness, *Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian)*, **36**, 509-519, 2023-2024.

Keywords:

dielectric constant, mechanical properties, expanded polystyrene, foam, cell wall thickness

مقاله پژوهشی

دسترس پذیر در نشانی: http://jips.ippi.ac.ir

مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سی وششم، شماره ۵. صفحه ۵۱۹–۵۰۹. ۱۴۰۲ ISSN: 1016-3255 Online ISSN: 2008-0883 DOI: 10.22063/JIPST.2024.3440.2254

وابستگی ثابت دیالکتریک و خواص مکانیکی اسفنج پلیاستیرن انبساطی به ضخامت دیواره سلول

داريوش گودرزي، سيد محمد حسيني، محمدرضا پورحسيني*، محمود رضويزاده، محمد خبيري، ميلاد سعادت تقرودي

تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، صندوق پستی ۱۷۷۴–۱۵۸۷۵

دریافت: ۱۴۰۲/۵/۹، پذیرش: ۱۴۰۳/۱/۱۸

چکیدہ

فرضیه: فناوری تهیه اسفنجهای پلیمری با ثابت دیالکتریک دلخواه در طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی کاربرد دارد. از آنجا که اثر مشخصههای ریزساختاری اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی (انبساطیافته) بر مشخصات دیالکتریک و خواص مکانیکی شایان توجه است. موضوع این مقاله به اثر ضخامت دیواره سلول اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی بر ثابت دیالکتریک، ضریب اتلاف، سختی و جهندگی اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی متمرکز شده است.

روشها: تعدادی نمونههای اسفنج پلیاستیرن انبساطی با مقدار تخلخل و ضخامت کل متفاوت با استفاده از برنامه مشخص گرمایی در کوره برنامه پذیر تهیه شدند. ابتدا، خواص فیزیکی از قبیل جرم حجمی و مقدار تخلخل اسفنج پلیاستیرن انبساطی تعیین شد و سپس مشخصههای ریزساختاری آنها مانند میانگین ضخامت دیواره سلولها با میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شدند. ثابت و ضریب اتلاف دیالکتریک نمونههای اسفنجی حاصل با دستگاه تحلیگر شبکهای برداری دارای آنتن شیپوری لنزدار ارزیابی شد و خواص مکانیکی نمونه اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی طبق سختیسنج شور D و مقدار انرژی مکانیکی قابل ذخیره با دستگاه جهندگی سنجش شدند.

یافتهها: مشخصههای دیالکتریکی مانند ثابت دیالکتریک و ضریب اتلاف دیالکتریک اسفنج پلیاستیرن با افزایش ضخامت دیواره سلولها در نمونههای با ضخامت کل برابر، بهترتیب تا ۱۲ و ۸۳٪ افزایش نشان میدهند. همچنین خواص مکانیکی نمونههای اسفنج پلیاستیرن از قبیل سختی و جهندگی نیز با افزایش ضخامت دیواره سلولها در نمونههای با ضخامت کل برابر، بهترتیب ۴۰ و ۴۲٪ افزایش نشان میدهند. در حالی که ثابت دیالکتریک و ضریب اتلاف دیالکتریک با کاهش ضخامت کل نمونه پلیاستیرن اسفنجی حین ثبات ضخامت دیواره سلولهای اسفنج پلیاستیرن کاهش می یابد، ضخامت کل نمونه اسفنج پلیاستیرن اثری بر مقدار سختی و جهندگی نشان نداد. واژههای کلیدی

ثابت دىالكتريك، خواص مكانيكى، پلىاستيرن انبساطى، اسفنچ، ضخامت ديواره سلول

*مسئول مكاتبات، پيامنگار: mrp_polycrc@mut.ac.ir

داریوش گودرزی و همکاران

بستگی ثابت دیالکتریک و خواص مکانیکی اسفنج پلیاستیرن انبساطی به ضخامت دیواره سلول

مقدمه

با توسعه سریع شبکه ارتباطی G۵، مواد پلیمری با ثابت دیالکتریک کمتر از ۲/۵ و ضریب اتلاف دیالکتریک کم برای استفاده در دستگاههای ارتباطی با سرعت زیاد کاربرد پیدا کردهاند [۲–۱]. هنگامی که مقدار ثابت دیالکتریک مواد پلیمری به ۲/۵ کاهش یابد، سرعت انتقال سیگنال تا ۱/۶ برابر افزایش مییابد [۳]. در نتیجه، پلیمرهای با ثابت دیالکتریک کم، مواد جذابی برای استفاده در شبکههای ارتباطی با سرعت زیاد، مانند دیالکتریکهای لایهای استفاده شده در آنتنها، کابلهای ارتباطی و تجهیزات مختلف مخابراتی هستند [۴]. کم، خواص مکانیکی مناسب، عایقبودن گرمایی [۱]، قابلیت جذب انرژی ضربه قابل قبول [۲]. خواص دیالکتریک [۳] و جذب امواج [۴] کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف نظیر خودروسازی [۵]، بستهبندی [۳،۶۰۷]، ساختمانسازی [۸] و مخابرات [۹] دارند.

تهیه اسفنج از مواد پلیمری، روش بسیار مؤثری برای کاهش ثابت دیالکتریک آنهاست [۱۴–۱۰]. Chen و همکاران [۱۵] اثر غلظتهای مختلف (٪۱۰وزنی تا ٪۴۰ وزنی) نیکل-روی-کبالت فریت (NZCFO) را بر خواص مغناطیسی و استحکام فشاری اسفنج یلی متاکریل ایمید (PMI) بر رسی کردند. آنان دریافتند، در بسامد ۱۲ GHz با افزایش مقدار نیکل-روی-کبالت فریت (NZCFO) میانگین اندازه سلول از ۲۸۰ µm تا ۳۰۰ افزایش و ثابت دیالکتریک از ۲/۷۴ تا ۲/۸۳ افزایش می یابد. Tran و همکاران [۱۶] اثر پارامترهای شکل شناسی (اندازه سلول، چگالی سلولی و ضخامت دیواره) اسفنج میکروسلولی (PMMA/MWCNTs) را بر رسانندگی الکتریکی در مقدار نانوذره ثابت بررسی کرده و مقادیر رسانندگی الکتریکی را با حالتهای اسفنجنشده مقایسه کردند. آنها دریافتند، برای دستیابی به اسفنجهای مشابه با ثابت دیالکتریک کم، اندازه سلول کوچک، چگالی سلول زیاد و ضخامت دیواره نازک مورد نیاز است. در پژوهشی Ma و همکاران [۱۷] خواص مکانیکی و دیالکتریک فشاری، ديناميكي و دىالكتريك اسفنجهاى پلىكربنات ميكروسلولى با توزيعهاي اندازه سلولي تكوجهي يا دووجهي ساختهشده با كربن دىاكسيد ابربحرانى سازگار با محيط را بررسى كردند. اين پژوهش آشکار کرد، خواص دیالکتریک اسفنجهای پلیکربنات میکروسلولی فقط به تخلخل کل بستگی دارد و به توزیع اندازه سلول یا ریزساختار اسفنج پلی کربنات بستگی ندارد و با افزایش تخلخل، ثابت دىالكتريك اسفنج پلىكربنات ميكروسلولى بەتدريج كاهش مىيابد. همچنین چگالی نسبی بیشتر به مدول ذخیره و اتلاف دیالکتریک زیادتر منجر می شود و اسفنج های دوساختاری (bimodal) به طور

شایان توجهی خواص مکانیکی فشاری و دینامیکی را در مقایسه با اسفنجهای تکساختاری (unimodal) با چگالی نسبی یکسان بهبود میبخشند.

Wang و همکاران [۱۸] خواص مکانیکی و دیالکتریک اسفنجهای پلی آریلن اترنیتریل (PEN) را بررسی کردند و دریافتند، با افزایش اندازه سلول از ۳۸ ۱۰۰ به ۳۳ ۲۶۰ ثابت دیالکتریک از ۱/۲۵ به PEN در Hz در ۲۳۰ افزایش مییابد. افزون بر این، اسفنجهای PEN خواص مکانیکی بسیار خوبی را با مدول ویژه تا γ۶۰ MPa·cm³/ و ازدیاد طول در شکست بیش از ۲۲٪ نشان میدهند. همچنین این اسفنجها بهاندازه کافی انعطاف پذیرند تا بدون شکستگی به طور مکرر خم و راست شوند. دستیابی همزمان به خواص دیالکتریک بسیار کم و عملکرد مکانیکی عالی، رقابت اسفنجهای PEN را برای کاربرد در دستگاههای میکروالکترونیک تشدید میکند.

خواص مختلف اسفنجهای پلیاستیرن بهویژه خواص مکانیکی و ثابت دیالکتریک به هر دو خواص ماتریس پلیمری و ساختار سلولی بستگی دارد. اندازه سلولها، تراکم سلولها، ضخامت دیواره سلولها، همگنی ساختار سلولی و مقدار تخلخل معیارهای مهم در بررسی کیفیت ساختار سلولی اسفنجهای پلیاستیرن است [۱۹]. Liao و همکاران [۲۰] اثر انواع گرافن (بلند، کوتاه و ترکیبی) بر فرایند اسفنج شدن، ساختار سلولی، ثابت دیالکتریک و آستانه نفود را در فرایند اسفنج نانوکامپوزیتی گرافن-پلیاستیرن با استفاده از کربن نشان داد، یک درصد حجمی گرافن بیشترین ثابت دیالکتریک در اسفنج پلیاستیرن ایجاد میکند. همچنین مشخص شد، اسفنجهای تهیهشده در شرایط اسفنجسازی ۲۰% MPa ۲ و ۲۰۰۸ سلولهای افزودن گرافن نشان میدهند.

تاکنون در مقالات مختلف اثر ریزساختار بر خواص مکانیکی و دیالکتریک اسفنجهای پلیمری بررسی شده است. در مطالعه حاضر افرون بر اثر ریزساختار اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی، اثر ضخامت نمونه اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی بر خواص دیالکتریک و خواص مکانیکی بررسی شده است. بههمین منظور ابتدا اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی با ضخامت و ریزساختار متفاوت به روشهای مختلف تهیه شد. سپس، عوامل ساختاری آنها از قبیل میانگین ضخامت دیواره سلولها و مقدار تخلخل اسفنج پلیاستیرن انبساطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شد و اثر آنها بر ثابت دیالکتریک و خواص مکانیکی اسفنج پلیاستیرن انبساطی ارزیابی شد.

تجربى

مواد

برای ساخت اسفنج پلیاستیرن انبساطی از محصول پلیاستیرن انبساطی پتروشیمی تبریز با کد مشخصه HS-321، چگالی ۶/۰۳۳ ۰/۰۳ اندازه دانه ۱mm –۷/۰ و ٪/۵/۲ وزنی پنتان طبیعی استفاده شد.

دستگادها و روشها

ساخت نمونهها با دو قالب فلزى استوانهاى انجام شد. قطر داخلي قالبها ۲۰ cm و ارتفاع قالب اول ۱ cm و ارتفاع قالب دوم ۳ cm است. قاعده پایین و بالای قالب را دو صفحه فلزی تشکیل میدهد که توسط تعدادی پیچ یکدیگر ملحق می شوند. در صفحه فلزی بالا و پایین تعدادی حفره (۱۵عدد) ریز به قطر ۱ mm برای خروج گاز پنتان دانه های پلی استیرن انبساطی ایجاد شد. با توجه به حجم مشخص قالبها و دانستن چگالی نمونههای مورد نیاز، وزن دانههای پلیاستیرن انبساطی برای تولید نمونههای با چگالیهای ۲/۰، ۳/۰، ۴/۴ و ۵/۱ محاسبه و توزین شد. در مرحله بعد برای تولید هر نمونه، دانههای پلیمر درون قالب به روش دستی ریخته شد و در کوره طی فرايند شكلدهي، پخت نمونه بهصورت دومرحلهاي انجام شد. بدين صورت که ابتدا قالب در کوره در دمای C°۰۰ و زمان min قرار داده شده و در مرحله دوم پس از گذشت min ۶۰ دمای آن از ۲۵۰°C به ۲۵ min تغییر یافت و در همان دما بهمدت ۳۵ min باقی ماند. سپس، قالب از کوره خارج و در معرض جریان هوای سرد قرار داده شد. پس از رسیدن دمای قالب به دمای محیط پیچهای قالب باز شده و نمونه از آن خارج شد. به هر نمونه یک کد داده شد.

برای تولید نمونههای EPS3، EPS2، EPS3 و EPS3 با چگالی ۲۰۳۰ با ی تولید نمونههای EPS4، دوبرای نمونههای EPS4، ۲۰۳۰ ۳/۳۰ از قالب با ارتفاع m ۳ استفاده شد. و برای نمونههای EPS4، EPS5 و EPS5 و EPS5 با چگالیهای بهترتیب ۲/۰، ۲/۰، ۶/۰ و ۵/۵ و ایجاد تفاوت در ضخامت دیواره سلولها مقداری از دانههای کم و ایجاد تفاوت در ضخامت دیواره سلولها مقداری از دانههای پلی استیرن پیش از فرایند پخت پیش پف شده و هنگام بارگذاری در قالب با دانههای پیش پف نشده با نسبت محاسبه شده، مخلوط و درون قالب ریخته شد و فرایند پخت انجام شد.

چگالی

چگالی اسفنج مطابق استاندارد ASTM D-3575 محاسبه شد. مقدار تخلخل اسفنج مطابق استاندارد $\rho_{\rm p}$ چگالی اسفنج و $\rho_{\rm p}$ چگالی اسفنج الی اسفنج و پالی ایمر است:

$$V_{ir} = 1 - \frac{\rho_f}{\rho_p} \tag{1}$$

ميكروسكوپ الكترونى پويشى

میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل XL300 ساخت شرکت Philips هلند، به کمک نرمافزار Jmage-j برای بررسی ساختار نمونه ها به کار گرفته شد. تعداد سلول در واحد حجم یا چگالی سلولی، اندازه متوسط سلول، کسر حجمی سلول ها و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب از معادله های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به دست آمد [۲1]:

$$N = \frac{6}{\pi d^3} \left(\frac{\rho_{P_s}}{\rho_{Foam}} - 1 \right)$$
(Y)

$$d = \frac{\sum n_i d_i}{\sum n_i} \tag{(7)}$$

$$V_{\rm f} = \frac{\rho_{\rm Foam}}{\rho_{\rm Ps}} \tag{(f)}$$

$$\delta = d(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\rho_f}{n}}} - 1) \tag{(a)}$$

N، b و V_f بهترتیب تعداد سلول در واحد حجم یا چگالی سلول، اندازه متوسط سلول و کسر حجمی سلولهاست.

خواص دىالكتريك

اجزای اصلی در اندازه گیری خواص دی الکتریک شامل دستگاه تحلیل گر شبکه و آنتن شیپوری لنزدار است. برای اندازه گیری مشخصات دی الکتریک نمونه از سامانه اندازه گیری متشکل از دو آنتن باند x لنزدار روبه روی هم استفاده شد. مقادیر بخش حقیقی و موهومی ثابت دی الکتریک و ضریب تلاف نمونه ها به وسیله تابع طراحی شده در نرمافزار Matlab برای تعیین مقادیر نامبرده از پارامترهای پراکندگی به دست آمده است. برای محیط رسانای خطی معادله ماکسول و ارتباط بخش حقیقی و موهومی ثابت دی الکتریک و ضریب اتلاف مطابق با معادله های (۶) تا (۸) است [۲۲]:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{\varepsilon}_r \tag{(\textbf{P})}$$

3، 6 و 3 بهترتیب گذردهی و گذردهی خلأ مواد ثابت دیالكتریک هستند و معادله:

$$\varepsilon_{\rm r} = \varepsilon_{\rm r}' - j\varepsilon_{\rm r}'' \tag{V}$$

نسبت مقدار اتلاف به ذخیره ضریب اتلاف است و با معادله (۸) تعریف می شود:

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon_{\rm r}''}{\varepsilon_{\rm r}'} \tag{A}$$

مجله علمی، علوم و تکنولوژی پلیمر ، سال سیوششم، شماره ۵، آذر–دی ۱٤۰۲

انرژی اتلافی بهوسیله اسفنج جذب می شود. بنابراین برای اینکه اسفنج امواج را بهخوبی عبور دهد و باعث اتلاف آن نشود، باید تا حد امکان tanδ آن کوچک باشد.

سختى

سختی نمونههای اسفنجشده با سختیسنج شور Shore D مدل ASTM D2240 ساخت شرکت HIVA، مطابق استاندارد ASTM D2240 اندازهگیری شد.

جهندگی

آزمون رفتار جهندگی و انعطافپذیری اسفنج با دستگاه جهندگی مدل HIVA 300 ساخت شرکت HIVA مطابق با استاندارد عملیاتی (91) ASTM-D1054 انجام شد.

نتايج و بحث

ميكروسكوپي الكتروني پويشي

در شکل ۱، نتایج آزمون میکروسکوپی الکترونی پویشی نمونههای اسفنج پلیاستیرن انبساطی نشان داده شده است. با تغییر در فرایند تولید و تغییر قالب، اسفنجهایی با ضخامت و ساختاری متفاوت



شكل ۱- تصاوير SEM اسفنجهای پلیاستيرن.

بهدست میآید. برخی اسفنجهای تولیدی با میانگین ضخامت دیواره سلولهای برابر و برخی دارای ساختار کنترلشده با افزایش تدریجی ضخامت دیواره سلولها بودند.

تصاویر میکروسکوپی بهخوبی نشان میدهد، با افزایش ضخامت دیواره سلولها، تراکم سلولها تقریباً ٪۷۳ کاهش مییابد. همچنین نتایج در جدول ۱ نشان میدهد، با افزایش مقدار تخلخل از ٪۵۰ به ۸۰٪ میانگین ضخامت دیواره سلولها، حدود ۲۱ ۲۱ افزایش مییابد.

خواص دىالكتريك

در جدول ۲ نتایج آزمون اندازه گیری مشخصات دیالکتریک نمونههای اسفنج پلی استیرن انبساطی در بسامد Hz ۱۰ نشان داده شده است. همان طورکه قابل مشاهده است، ثابت دیالکتریک نمونهها از ۱/۲۱۹ تا ۱/۴۳۰ در تغییر است. در حالی که همه نمونهها از جنس پلی استیرن انبساطی هستند، تغییر در تخلخل، ضخامت دیواره سلولها و تراکم سلولهای نمونهها باعث تغییر قابل ملاحظه در ثابت دیالکتریک آنها شده است. مقایسه نمونههای EPS4 EPS5 و EPS5 نشان می دهد، در عین دار ابودن ضخامت یکسان به ترتیب تخلخل آنها کاهش یافته است. با افزایش ضخامت دیواره سلولها ثابتهای دی الکتریک ٪۱۲ و ضرایب اتلاف نمونهها مراه افزایش می یابد. طبق نتایج با کاهش تخلخل و افزایش چگالی،



Fig. 1. SEM images of polystyrene foams.

مجله علمی، علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سیوششم، شماره ۵، آذر–دی ۱٤۰۲

جدول ۱- نتایج تحلیل تصاویر SEM اسفنجهای پلیاستیرن.

داریوش گودرزی و همکاران

Sample	Average cell	Cell density	Porosity	Average cell wall	Density	Sample
	size (µm)	(cell/cm ³)	(%)	thickness (µm)	(g/cm^3)	thickness (cm)
EPS1	75	1.69×10^{10}	70±5	14.6	0.3±0.05	3±0.1
EPS2	77	1.52×10^{10}	70±5	15.0	0.3±0.05	3±0.1
EPS3	93	8.76× 10 ⁹	70±5	18.2	0.3±0.05	3±0.1
EPS4	65	2.91×10^{10}	80±5	7.7	0.2 ± 0.05	1±0.1
EPS5	77	$1.57 imes 10^{10}$	70±5	14.9	0.3±0.05	1±0.1
EPS6	82	1.08×10^{10}	60±5	23.9	$0.4{\pm}0.05$	1±0.1
EPS7	86	0.786×10^{10}	50±5	35.6	0.5±0.05	1±0.1
EPS8	75	6.59×10^{9}	70±5	14.5	0.3±0.05	3±0.1

Table 1. The results of SEM	I image analysis of	f polystyrene foams.
-----------------------------	---------------------	----------------------

در بسامد A GHz تا ۱۲ GHz با افزایش میانگین ضخامت سلولها در اسفنجها افزایش مییابد.

در محدوده بسامد GHz تا GHz مشخص شد، با افزایش ضخامت دیواره سلولها در تمام بسامدهای بررسی شده ثابت دیالکتریک افزایش مییابد. البته در صورت برهم کنش فیزیکی میان اجزای اسفنج، ثابت دیالکتریک آن مطابق قانون مخلوطها، رفتاری خطی نشان میدهد. در حالی که مطابق شکل ۲ با افزایش میانگین ضخامت سلولها از μα ۷/۶۷ تا μα ۳۵/۶۲، ثابت دیالکتریک از ۱/۲۱۹ تا ۱/۳۹۶ افزایش مییابد. همان طورکه از نمودار مشخص است، رفتار ثابت دیالکتریک در مقابل ضخامت دیواره سلولی رفتار تقربیاً غیرخطی است، زیرا تخلخل این نمونهها در عین دارابودن

جدول ۲- مشخصات دیالکتریک اسفنجهای پلیاستیزن در بسامد ۱۰ GHz.

Table 2. Dielectric characteristics of polystyrene foams at10 GHz frequency.

Sample	Loss factor	Real dielectric constant
EPS1	0.0184	1.405
EPS2	0.0241	1.430
EPS3	0.0181	1.391
EPS4	0.0020	1.219
EPS5	0.0114	1.327
EPS6	0.0030	1.354
EPS7	0.0043	1.396
EPS8	0.0167	1.298

ضخامت یکسان به تر تیب کاهش یافته است. در تخلخل های متفاوت با افزایش ضخامت دیواره سلول ها ثابت دی الکتریک افزایش می یابد و از مقدار عبور امواج الکترومغناطیس در اسفنج کاسته می شود. رفتار غیر خطی ثابت دی الکتریک در برابر افزایش ضخامت دیواره ناشی از تغییرات ضخامت دیواره سلول های اسفنج با تخلخل های متفاوت در نمونه ها بوده است که بعید نیست، ناشی از نبود دقت کافی یا توزیع در مقدار متوسط محاسبه شده برای ضخامت دیواره سلول های اسفنج باشد، بنابراین در ادامه با استفاده از خواص کشسانی مانند سختی یا جهندگی این نکته ارزیابی می شود.

مطابق شکل ۳، نمونههای EPS1 و EPS8 دارای ضخامت کل و ضخامت دیواره سلولهای برابر هستند. البته نمونه EPS8 از کنار هم قراردادن نمونه های EPS5، EPS4 و EPS6 ایجاد شده است. با مقایسه این دو نمونه مشخص شد، ثابت دیالکتریک از ۱/۴۰۵ به ۱/۲۹۸ و ضريب اتلاف از ۱۸۴ /۰ به ۱۶۷ /۰ کاهش می يابد. اين روند کاهشي بهخوبی نشان میدهد، در تخلخل، ضخامت نمونه و ضخامت دیواره سلولهای کل تقریباً برابر (روند افزایشی ضخامت دیواره سلولها از نمونه EPS4 تا EPS6)، با افزایش تدریجی میانگین ضخامت دیواره سلولها، ثابت دىالكتريك و ضريب اتلاف كاهش مى يابد. با توجه به این نکته مشخص است، افزایش تدریجی میانگین ضخامت دیواره سلولها در ضخامت نمونه و ضخامت دیواره سلولهای کل تقریباً برابر اثر ۷/۶ درصدی بر ثابت دیالکتریک و ۳۷ درصدی بر ضریب اتلاف دارد. در یک اسفنج افزایش تدریجی ضخامت آن بهترتیب از ریز به درشت چیده شدهاند، ثابت دیالکتریک بخش ورودی موج کمترین انتخاب مي شود تا بيشترين موج ممكن وارد اسفنج شود. در اين حالت اسفنج همانند ماده تطبيق امپدانس عمل کرده و نسبت موج ايستا ورودي

مجله علمی، علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سیوششم، شماره ۵، آذر–دی ۱٤۰۲



شکل ۳- ارتباط ثابت دیالکتریک با بسامد اسفنجهای پلی استیرن. Fig. 3. Dielectric constant relationship with the frequency of polystyrene foams.

از نمونه با ضخامت ۳ cm است که ناشی از تعداد دیوارههای سلول کمتر در برابر مسیر گذر موج الکترومغناطیس در اسفنج با ضخامت کمتر است. همان طور که مشخص است، ثابت دی الکتریک و ضریب اتلاف نمونه با ضخامت ۲ cm از نمونه با ضخامت ۳ cm کمتر است. این نشان می دهد، هر چقدر پلیمر اسفنجی در برابر مسیر امواج کمتر باشد. برهم کنش امواج با ماده کمتر می شود و انتقالهای کوانتومی کمتری در ماده اتفاق می افتد و امواج الکترومغناطیس با بر خورد کمتری از ماده عبور می کند و ثابت دی الکتریک و ضریب اتلاف نیز کمتر می شود.



شکل ۴- ارتباط ثابت دیالکتریک با بسامد در نمونههای با ضخامت متفاوت.

Fig. 4. Dielectric constant relationship with frequency in different thickness samples.



شكل ۲- ارتباط ثابت دى الكتريك با ميانگين ضخامت ديواره سلول. Fig. 2. Dielectric constant relationship with the average thickness of the cell wall.

کمتر شده و باعث ورود بیشتر موج در اسفنج می شود. همین تدبیر باعث می شود، ثابت دی الکتریک و ضریب اتلاف کلی اسفنج کمتر شود. البته ثابت دی الکتریک و ضریب اتلاف و VSWR پارامترهای وابسته به مواد بوده و غیرمستقل هستند. کلیه خواص الکتریکی و مغناطیسی و الکترومغناطیسی مواد از انتقالهای کوانتومی پیچیده حاصل از برهم کنش مواد و امواج الکترومغناطیس به وجود می آید.

با مقایسه ثابت دیالکتریک اسفنجهای EPS2 و EPS5 با تخلخل و ضخامت دیواره سلولهای برابر مشخص شده است که در محدوده بسامد GHz ۲ ما GHz ۲، ثابت دیالکتریک نمونه با کاهش ضخامت نمونه در تمام محدوده بسامدی کمتر از نمونه با ضخامت بیشتر است. شکل ۴ ارتباط ثابت دیالکتریک با بسامد را در نمونههای با ضخامت متفاوت نشان می دهد. همان طور که پذیرفته شده است، هر چقدر پلیمر واقع در مسیر یا تعداد دیواره های سلول کمتری در برابر مسیر گذر موج الکترومغناطیس از درون اسفنج پلیاستیرن انبساطی قرار گیرد، برهم کنش امواج با ماده کمتر می شود و انتقالهای کوانتومی کمتری ماده عبور می کند و ثابت دیالکتریک نیز کمتر می شود. البته این پدیده با افزایش همزمان ضریب اتلاف امواج الکترومغناطیس حین عبور از اسفنجهای ضخیمتر قابل تأیید است.

شکل ۵ ارتباط ضریب اتلاف با بسامد را در نمونههای با ضخامت ۱ و ۳ cm نشان میدهد. در این شکل با مقایسه دو نمونه EPS2 و EPS5 (با تمام مشخصات برابر مطابق جدول ۱ غیر از ضخامت کلی اسفنج) مشخص شده است که در بررسی بسامد GHz ۸ تا GHz کمتر ضریب اتلاف نمونه با ضخامت ۱ cm در اکثر محدوده بسامدی کمتر



(جدول ۳). زیرا، سختی بهعنوان مشخصه مکانیکی و تابع مدول کشسان مواد پلیمری در ضخامت دیواره سلول برابر به عواملی همچون نوع پلیمر، چگالی اسفنج و سایر موارد نیز بستگی دارد. این مشاهده دقت اندازه گیری سختی گزارش شده در جدول ۳ را تأیید میکند تا انحراف هرچند جزئی در سختی مطابق شکل ۶ را شایان توجه دانست که بهطور مطمئنی نشانگر توزیع گسترده اندازه ضخامت ديواره سلول محاسبهشده براي اسفنجهاي پلياستيرن مورد مطالعه باشد.

جهندگی

بهمنظور کنترل دوباره و مستقل وقوع توزیع گسترده در مقدار متوسط محاسبه شده برای ضخامت دیواره سلول های اسفنج به عنوان دلیل تغییرات غیر خطی ثابت دی الکتریک در بر ابر ضخامت دیواره سلول های اسفنج (مطابق شکل ۲) جهندگی اسفنج پلیاستیرن بررسی شد، زیرا جهندگی خاصیت کشسان وابسته به اندازه و توزیع ضخامت دیواره سلولهای اسفنج است. در جدول ۴ و شکل ۷، بهترتیب نتایج آزمون جهندگی و ارتباط جهندگی نمونههای اسفنج پلیاستیرن انبساطی با میانگین ضخامت دیواره سلولها نشان داده است. هنگامی که اسفنج در اثر ضربه آونگ جهندگی تغییرشکل موقتی میدهد، انرژی ذخیره شده در دیواره سلولهای اسفنج با بازگشت اسفنج به شکل اولیه خود آزاد می شود. با توجه به تصویر و مقایسه نمونه های EPS4، EPS6، EPS5 و EPS7 که چگالی آنها بهترتیب افزایش یافته است و ضخامت نمونه يكساني دارند، با افزايش ضخامت ديواره سلولها جهندگی نمونهها از ٪۷/۴۵ به ٪۱۲/۹۱ افزایش می یابد. در آزمون جهندگی مشخص شد، رفتار جهندگی نیز در مقابل افزایش ضخامت ديواره سلولها رفتار غيرخطي شبيه تغييرات ثابت دىالكتريك با

جدول ۳- نتایج آزمون سختی نمونه های اسفنج شده. Table 3. Hardness test results of foam samples.

Sampla	Average cell wall thickness	Hardness
Sample	(µm)	(Shore D)
EPS1	14.64	44±5
EPS2	15.03	51±5
EPS3	18.15	53±5
EPS4	7.67	40±5
EPS5	14.96	51±5
EPS6	23.86	57±5
EPS7	35.62	67±5



شکل ۵- ارتباط ضریب اتلاف با بسامد در نمونه ها با ضخامت های متفاوت.



همانطور که در تحلیل نتایج شکل ۲ بحث شد، دلیل رفتار دیالکتریک غیرخطی در برابر ضخامت دیواره سلولهای اسفنج را باید در امکان چندتوزیعیبودن یا توزیع گسترده در مقدار متوسط محاسبهشده برای ضخامت دیواره سلولهای اسفنج جستوجو کرد. بنابراین سختی بهعنوان خاصیت کشسان وابسته به اندازه و توزيع ضخامت ديواره سلولهاى اسفنج بررسى شد. سختى تابع مدول کشسانی پلیمرها و ضخامت دیواره سلولهای اسفنج است. در جدول ۳ و شکل ۶، بهترتیب نتایج آزمون سختی و ارتباط سختی نمونه های اسفنج پلی استیرن انبساطی با میانگین ضخامت دیواره سلولها نشان داده شده است. با توجه به شکل ۶ و مقایسه نمونههای EPS6 ، EPS5 ، EPS4 و اضح است، چگالی این نمونهها بهترتیب افزایش یافته است، در حالی که نمونهها ضخامت یکسانی دارند، با افزایش ضخامت دیواره سلولها سختی نمونهها از ۴۰ Shore D به ۶۷ Shore D تقريباً ٪۴۰ افزایش می یابد. البته روند افزایش سختی حسب افزایش ضخامت محاسبه شده برای دیواره سلولها بهطور كامل خطى نيست. از أنجا كه خطىبودن رابطه سختى با مدول و چگالی پلیمر پذیرفته شده است. از اینرو، این یافته بیانگر امکان وقوع چندتوزیعی یا توزیع گسترده در مقادیر متوسط ضخامت ديواره سلول محاسبه شده براي اسفنج هاست.

همچنین با مقایسه نمونه EPS2 و EPS5 با تخلخل و ضخامت ديواره سلول هاي برابر، مشخص شده است، تغيير ضخامت نمونه اثرى بر سختى نمونه اسفنج پلى استيرن انبساطى (۵۱ Shor D) ندارد

سختي





نمونه اثر محسوسی بر جهندگی (۸/۲۳٪) ندارد. این برابری مقدار جهندگی در شرایط مشابه و صخامت متفاوت قابلیت اطمینان و دقت اندازهگیری جهندگی در نمونههای اسفنج پلیاستیرن تحت آزمون را نیز تأیید میکند.

نتيجه گيري

در مطالعه حاضر، نقش ضخامت دیواره سلولها و ضخامت نمونه بر خواص دیالکتریک و خواص مکانیکی اسفنجهای پلیاستیرن انبساطی ارزیابی شده است. بدین منظور نمونههای اسفنج پلیاستیرن متفاوت دیواره سلولها، با استفاده از کوره برنامه پذیر تهیه و ساختار سلولی، ثابت دیالکتریک، سختی و جهندگی اسفنجها بررسی شد. نتایج نشان داد، در تخلخل متفاوت و ضخامت یکسان نمونه، با افزایش میانگین ضخامت دیواره سلولهای اسفنج، ثابت دیالکتریک و ضریب اتلاف روند افزایشی دارد. همچنین در ضخامت دیواره تابت دیالکتریک و ضریب اتلاف افزایش مییابد. همان طورکه شخص شده است، ثابت دیالکتریک و ضریب اتلاف نمونهای که شخص شده است، ثابت دیالکتریک و ضریب اتلاف نمونه یک روند تدریجی افزایش ضخامت دیواره سلولها را داشته از نمونه با مشخص ثابت دیواره سلولها را داشته از نمونه با



شکل ۶- ارتباط سختی نمونههای اسفنج شده با میانگین ضخامت دیواره سلول.

Fig. 6. The relationship between the hardness of foam samples and the average thickness of the cell wall.

افزایش ضخامت دیواره سلولها نشان میدهد. نتایج مشابه این روند غیرخطی خواص جهندگی در اسفنجهای پلیمری در مطالعات Lopattananon نیز مشاهده شده است [۲۳]. مشاهده رفتار غیرخطی ثابت دیالکتریک، سختی و جهندگی اسفنجهای پلیاستیرن در برابر ضخامت دیواره سلول اسفنج مشخص میکند، توزیع اندازه سلولها پهن و دارای اهمیت است، زیرا هر سه این خواص به ضخامت دیواره سلول وابستگی دارند و هرچقدر توزیع ضخامت سلولها گستردهتر باشد، انحراف رفتار اسفنج پلیاستیرن از مدل مخلوطها یا خطی محسوس تر است.

همچنین مقایسه نمونه EPS2 و EPS5 با تخلخل و ضخامت برابر دیواره سلولها، مشخص کرده است، مطابق جدول ۴ تغییر ضخامت

جدول ۴- نتایج آزمون جهندگی نمونههای اسفنجشده.

Table 4. The results of the resilience test of foam samples.				
Average cell wall thickness	Resilience			
(µm)	(%)			
14.64	8.10			
15.03	8.23			
18.15	8.35			
7.67	7.45			
14.96	8.23			
23.86	9.36			
35.62	12.91			
	Average cell wall thickness (μm) 14.64 15.03 18.15 7.67 14.96 23.86 35.62			

داریوش گودرزی و همکاران

میدهند. همچنین سختی اسفنجها نیز تابعیت کاملاً خطی از ضخامت دیواره سلولهای اسفنج پلیاستیرن را نشان نمیدهد. مشاهده رفتار غیرخطی ثابت دیالکتریک، سختی و جهندگی اسفنجهای پلیاستیرن در برابر ضخامت دیواره سلول اسفنج مشخص میکند، توزیع اندازه سلولها گسترده و دارای اهمیت است، زیرا هر سه این خواص به ضخامت دیواره سلول بستگی دارند و هر چقدر توزیع ضخامت سلولها گستردهتر باشد، انحراف رفتار اسفنج پلیاستیرن از مدل مخلوطها یا خطی محسوستر است.

مراجع

- Jürgen S. and Wallis M., Dependence of Thermal Properties of Expandable Polystyrene Particle Foam on Cell Cize and Density, *J. Cell. Plast.*, 46, 209-222, 2010.
- Beverte G. and Ilze Y., Deformation of Polypropylene Foam Neopolen®P in Compression, J. Cell. Plast., 40, 191-204, 2004.
- Sanchez R., Alejandro E., Gomez-Ma'rquez G., Aguilera-Gomez E., Ledesma-Orozco E.R., and Plascencia-Mora H., Numerical Analysis of Energy Absorption in Expanded Polystyrene Foams, *J. Cell. Plast.*, 56, 411-431, 2020.
- Gehuan W., Hoong Ong S., Zhao Y., Xu Z.J., and Ji G., Integrated Multifunctional Macrostructures for Electromagnetic Wave Absorption and Shielding, *J. Mater. Chem.*, 46, 24368-24387, 2020.
- Raps K., Daniel J., Hossieny N., Park C., and Altstädt V., Past and Present Developments in Polymer Bead Foams and Bead Foaming Technology, *Polymer*, 56, 5-19, 2015.
- Turner A., Foamed Polystyrene in the Marine Environment: Sources, Additives, Transport, Behavior, and Impacts, *Environ. Sci. Technol.*, 54, 10411-10420, 2020.
- Block C., Brands B., and Gude T., Packaging Materials 2. Polystyrene for Food Packaging Applications-Updated Version, *Nutr. Clin. Care*, 13, 321-336, 2017.
- Sulong R., Hafizah N., Aisyah Syaerah Mustapa S., and Khairi Abdul Rashid M., Application of Expanded Polystyrene (EPS) in Buildings and Constructions: A Review, *J. Appl. Polym. Sci.*, 136, 475-495, 2019.
- 9. Bezborodov V., Kosiak O.S., Kuleshov Y.M., and Yachin V., Differential Phase Sections Based on Form Birefrigence in the

باعث کاهش ثابت دیالکتریک و ضریب اتلاف در اسفنجها شده است. با افزایش ضخامت دیواره سلولها سختی افزایش مییابد، اما در ضخامت دیواره سلولهای برابر، تغییر ضخامت نمونه اثری بر سختی ندارد. همچنین با توجه به نتایج آزمون جهندگی مشخص شده است، با افزایش ضخامت دیواره سلولها جهندگی افزایش مییابد، اما در ضخامت برابر دیواره سلولها، تغییر ضخامت نمونه اثری بر جهندگی نداشته است. در این پژوهش مشخص شد، تمام رفتارهای وابسته به ضخامت دیواره سلول مانند جهندگی و ثابت دیالکتریک رفتار غیرخطی واضحی در برابر افزایش ضخامت دیواره سلولها نشان

Terahertz Frequency Range, Telec Rad. Eng., 74, 43-59, 2015.

- Lei X., Tong L., Pan H., Yang G., and Liu X., Preparation of Polyarylene Ether Nitriles/Fullerene Composites with Low Dielectric Constant by Cosolvent Evaporation, *J. Mater. Sci. Mater. Electron.*, **30**, 18297-18305, 2019.
- Yuan C., Jin K., Li K., Diao K., Tong J., and Fang Q., Non-Porous Low-k Dielectric Films Based on a New Structural Amorphous Fuoropolymer, *Adv. Mater.*, 25, 4875-4878, 2013.
- Wang L., Liu C., Shen S., Xu M., and Liu X., Low Dielectric Constant Polymers for High-Speed Communication Network, *Adv. Ind. Eng. Polym.*, 34,138-148, 2020.
- Barczew M., Kozakiewicz C., and Krucińska I., The Effect of Foam Morphology on Dielectric Properties of Closed-Cell Foams Based on High-Density Polyethylene, *Polym. Test.*, 89, 231-245, 2020.
- Zhang Y., Yang Y., Xu Y., and Chen W., Low-Dielectric Constant Foam Materials through Polymer Blends, *Appl. Polym.*, 49, 321-420, 2020.
- Chen W., Yao Z., Lin H., Zhou J., Haidry A., Qian Y., Guo X., and Qian K., Electromagnetic and Microwave Absorption Performance of Ni_{0.4}Zn_{0.4}Co_{0.2}Fe₂O₄/Polymethacrylimide Foam Synthesized via Polymerization, *J. Mater. Sci. Mater. Electron.*, **30**, 16991-17002, 2019.
- Tran M.P., Detrembleur C., Alexandre M., Jerome C., Thomassin J.M., The Influence of Foam Morphology of MWCNT/PMMA Nanocomposites on Electrical Conductivity, *Polymer*, 54, 3261-2370, 2013.
- Ma Z., Zhang G., Yang Q., Shi X., and Liu Y., Mechanical and Dielectric Properties of Microcellular Polycarbonate Foams

with Unimodal or Bimodal Cell-Size Distributions, J. Cell. Plast., **51**, 307-327, 2015.

- Wang L., Liu X., Liu C., Zhou X., Liu C., Cheng M., Wei R., and Liu X., Ultralow Dielectric Constant Polyarylene Ether Nitrile Foam with Excellent Mechanical Properties, *Chem. Eng. J.*, **384**, 123-231, 2020.
- Taher A. and Hasanzadeh R., A Review on Principles and Fundamentals of Fabrication of Polymeric Foams in Regards to Increasing Cell Density/Reducing Cell Size, *Mod. Mech. Eng.*, 19, 211-222, 2019.
- 20. Xiao W., Liao X., Jiang Q., Zhang Y., Chen J., Yang Q., and Li G., Strategy to Enhance Conductivity of Polystyrene/Graphene

Composite Foams via Supercritical Carbon Dioxide Foaming Process, *J. Supercrit. Fluids*, **142**, 52-63, 2018.

- Chimezie O., Raps D., Subramaniam K., and Altstädt V., Microcellular to Nanocellular Polymer Foams: Progress and Future Directions–A Review, *Eur. Polym. J.*, 73, 500-519, 2015.
- Silaghi M.A., Polymer Dielectric Materials, In *Dielectric Materials*, IntechOpen, Novi Sad, Croatia, 1st ed., 60-85, 2012. DOI:10.5772/2781
- Lopattananon N., Julyanon J., Masa A., Kaesaman A., Thongpin C., and Sakai T., The Role of Nanofillers on (Natural Rubber)/ (Ethylene Vinyl Acetate)/Clay Nanocomposite in Blending and Foaming, *J. Vinyl Add. Technol.*, **21**, 134-146, 2015.

919